





Evolution du tungstène monocristallin sous irradiation hélium: suivi GISAXS in-situ de la formation et évolution des bulles d'hélium

DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE

Elodie Bernard, Loïc Corso, Stefano Curiotto et Frédéric Leroy





Contexte: mécanismes de formation des bulles et évolution du contenu en He



- Caractérisation des bulles d'He dans des échantillons exposé dans le LHD: collaboration Cormac Corr, Matt Thompson (ANU) et Ryuichi Sakamoto (NIFS)
- Evolution de la morphologie des bulles d'He avec température post exposition (thèse Mykola lalovega)
- **Objectif:** observer l'interaction He-W in situ pour accéder à la dynamique des mécanismes dès les prémices de la formation des bulles
 - Evolution de la surface W: LEEM (Low-Energy Electron Microscope) couplé in situ avec irradiation He et contrôle en temperature
 - Formation et évolution des bulles: GISAXS (Grazing Incidence Small Angle X-Ray Scattering) couple in-situ avec irradiation He et contrôle en temperature + microscopie post-mortem (MEB, TEM, AFM)
 - Compréhension des mécanismes fondamentaux
 - Pour l'élaboration de codes de modélisation
 - Pour l'interprétation des expositions complexes in situ



CINaM

ESRF

M. Thompson et al., JNM 473 (2016)



2

1 – GISAXS

Principe Ligne BM32 ESRF

2 – Irradiation He des monocristaux de W

Préparation des surfaces Suivit in-situ de l'implantation et du recuit

3 – Analyses post recuit

Caractérisation de la surface Caractérisation des bulles

Conclusion



Grazing Incident Small Angle X-ray Scattering – Diffusion centrale des rayons X en incidence rasante

Principaux avantages :

- 1. Analyse non destructive
- Petits angles d'incidence → Sensibilité de la surface et proche surface (dizaine Å à quelques µm)
- 3. Donne accès à la **morphologie des objets** en présence (formes et tailles de bulle, état de surface)
- 4. Sensible à l'organisation des objets présents (Distance moyenne entre bulles)
- 5. L'étalement du faisceau permet une vue statistique des phénomènes en jeu







GISAXS - Ligne BM32 ESRF



IRfm

VAN





Protocole de préparation (échantillons W (110), W (100) et W (111)) :

- 1) Recuit sous oxygène à haute température (1000°C)
- 2) Recuit flash sous vide à très haute température (1500-2000°C)
- 3) Conditionnement : Dépôt de 5 nm d'or

Spectroscopie Auger → Composition chimique de la surface

Principe :

- a. Excitation d'un électron de cœur
- b. Désexcitation non radiative d'un électron d'une couche supérieur vers le niveau de cœur vacant
- c. L'énergie récupéré expulse un électron des couches lointaines qui est capté par le détecteur



LEEM \rightarrow Morphologie de surface

Principe :

```
Envoi d'électrons lents (1-100eV) → Rétrodiffusion des électrons (imagerie et diffraction)
```



6



Protocole de préparation :

- 1) Recuit sous oxygène à haute température (1000°C)
- 2) Recuit flash sous vide à très haute température (1500-2000°C)
- 3) Conditionnement : Dépôt de 5 nm d'or
- **Spectroscopie Auger** \rightarrow Composition chimique de la surface



LEEM \rightarrow Morphologie de surface







W (100) ESRF 2 :

Etape préliminaire : Orientation de l'échantillon



Cea



20

ω

a

$\alpha_i = 0.4^\circ$ and $\omega = 16.07^\circ$ (h00 direction)

Avant bombardement He



Tige spéculaire étroite \rightarrow Structure cristalline étendue (Surface)

de surface

Bombardement He : 1^{er} instant

Intensité diffuse due à des

bulles sphériques

Bombardement He : Instant final



Facette (10-1)

Tige spéculaire large \rightarrow Modification morphologique importante de la surface

9

de surface



Irradiation He - Suivit in-situ de l'implantation et du recuit



IRfm

CÍ**Ň**aM

Cea

Irradiation He - Suivit *in-situ* de l'implantation et du recuit





le







Analyses post recuit





Microscopie électronique à balayage (MEB)

- ➢ Trous carrés ou rectangulaires résultants de l'éclosion de bulle en surface → bulles non sphérique
- Densité de bulles remontées à la surface : 1,03x10² µm⁻²



Amas de matière présents à l'éclosion des bulles

cea

Analyses post recuit

▶ 0 µm 0,2 1,4 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,6 1,8



- Microscopie à Force Atomique (AFM)
- Trous de 5 à 10 nm

0,5

0,4

> Forme laissée par l'éclosion d'une bulle remontant à la surface



14,2 nm

Cea

Analyses post recuit





Microscopie électronique à transmission (MET)

- Bulles fermées sous la surface encore pressurisées en hélium
- Bulles éclos en surfaces
- Densité de bulle dans le volume
 1,26x10⁴ bulles.µm⁻³



Bubble size (nm)

cea





1. Préparation des échantillon

- a. Cycle de recuit (1000°C) sous oxygène Recuit flash (1500°C 2000°C) sous ultra-vide avec contrôle de la composition chimique de la surface (Spectroscopie Auger) et de la morphologie (LEEM)
- b. Dépôt d'une couche de protection en Au

2. Suivi GISAXS In-situ pendant l'implantation d'He

- Désorption de l'Au \rightarrow Chauffage à 1000°C sous ultra-vide a.
- b. Orientation de l'échantillon
- Implantation à 1000°C (lot 1) ou température ambiante (lot 2) et recuit jusqu'à 1500°C (lot 1 et 2)
 - Bulles sphérique en début d'implantation
 - Facettage des bulles par des plan (110)
 - Reconstruction de la surface dans son état initial

3. Analyses post recuit

- a. Caractérisation de la surface
 - \rightarrow MEB \rightarrow Surface pas totalement lisse avec des trous
 - \blacktriangleright AFM \rightarrow Trous de plusieurs nm laissés par des bulles
- b. Caractérisation des bulles
 - \rightarrow MET \rightarrow Densité de bulles de **1,26x10⁴ bulles.µm**⁻³, distribution en **taille de quelque nm à 50nm**

Alimentation d'un model de simulation « IsGISAXS »